

JAYS SOLUTION CATALOG VER.4

제이스 솔루션 제품 시리즈

Inter-Connection SOLUTION

Connector/Adapter

- J-Link JCO
- J-Link JAD

Cable

- J-Link JCA
- GORE

Probe Solution

- J-Link JPB
- Giga-probe
- EMI안테나/프로브(DC~3 GHz)

RF 스위치 시스템

- J-Link JSS

Fixture

- Wilder Technologies

반도체 측정

- Metrics 반도체 특성(IV,CV) 측정 소프트웨어

측정자동화(ATE) SOLUTION

유전율 측정

- J-Link Dielectric

TDR 측정

- E5080B-TDR 네트워크/임피던스 분석기
- Streamline Series VNA with TDR
- CT100B 케이블/TDR 분석기

PCB 검사/수리

- Huntron Tracker PCB 검사/수리 분석기
- Huntron Access Probe 자동 프로빙 시스템

Hardware

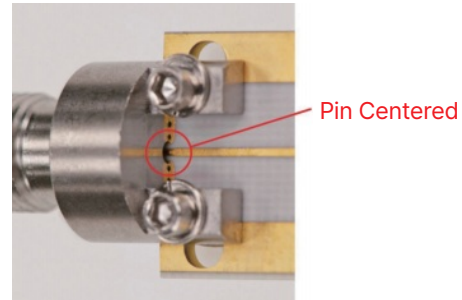
J-Link JCO Series: 고대역/고성능 커넥터	P.3
J-Link JAD Series: 고대역/고성능 어댑터	P.4
J-Link JCA Series: 고대역/고성능 케이블	P.5
GORE® PHASEFLEX®: 고대역/고성능 케이블	P.7
J-Link JPB Series: 프로브 스테이션	P.9
Giga-probe: 고대역/정밀 측정 프로브	P.11
J-Link JSS Series: RF 스위치 시스템	P.13
근접장 안테나 프로브: EMI 안테나/프로브	P.14
Wilder Technologies: 디지털 신호 측정용 픽스처	P.15
반도체 측정 특성 소프트웨어: Metrics 반도체 특성(IV,CV) 측정 소프트웨어 ..	P.18

고대역 PCB용 커넥터

J-Link JCO Series 고대역/고성능 커넥터

미국 Signal Microwave 사와 협업하여 ODM방식으로 생산되는 고대역/고성능 커넥터로서, (주)제이스의 엄격한 품질관리와 보증이 제공됩니다.

- 2.92/2.4/1.85/1.0 mm 인터페이스
- 40/50/67/110 GHz Bandwidth
- Edge/Vertical 등 다양한 Launch 형태
- 납땜이 필요없는 구조
- Narrow Profile: Differential Line PCB 설계에 효율적인 구조
- Standard Profile: 기존의 고가 커넥터와 호환되는 구조



	Model	Bandwidth	Type	Gender	Launch	Available option
	JCO-E110	110 GHz	1.0 mm	Female	Edge	·Narrow ·Standard
	JCO-E70	67 GHz	1.85 mm	Female	Edge	·Narrow ·Standard
	JCO-E50	50 GHz	2.4 mm	Female	Edge	·Narrow ·Standard
	JCO-E40	40 GHz	2.92 mm	Female	Edge	·Narrow ·Standard
	JCO-V40	40 GHz	2.92 mm	Female	Vertical	
	JCO-T40	40 GHz	2.92 mm	Female	Top	
	JCO-T50	50 GHz	2.4 mm	Female	Top	Signal이 Via를 통과하지 않아도 된다.
	JCO-R40-01	40 GHz	2.92 mm	Female	Field Placeable	
	JCO-R40-02	40 GHz	2.92 mm	Female	Field Placeable	
	JCO-R40-03	40 GHz	2.92 mm	Female	Field Placeable	
	JCO-R40-04	40 GHz	2.92 mm	Female	Field Placeable	
	JCO-R40-05	40 GHz	2.92 mm	Female	Field Placeable	

고대역 PCB용 어댑터 J-Link JAD Series 고대역/고성능 어댑터

국내 어댑터 전문업체와 협업하여 ODM방식으로 생산되는 가성비 최고의 고대역/고성능 어댑터로서, (주)제이스의 엄격한 품질관리와 보증이 제공됩니다.

제품의 특징

- MIL-STD-348 충족
- 6/18/26.5/40/50 GHz 등 다양한 어댑터 고유의 Bandwidth 지원
- Phase Matched 어댑터: ±2도 이내의 위상차
- 고대역에서도 낮은 VSWR
- 고성능대비 경제적인 가격

일반적인 특성

Frequency [GHz]	Interface	VSWR Max.
DC ~ 50 GHz	2.4 mm, SMPM	<1.25
DC ~ 40 GHz	2.92 mm (k), SMP	<1.25
DC ~ 26.5 GHz	HFSMA®, SMP	<1.22
DC ~ 18 GHz	SMA, N	<1.2
DC ~ 6 GHz	MCX, MMCX, Etc.	<1.2



JAD40V1V0

지원되는 어댑터와 매칭에 따른 Bandwidth

	SMA(m)	SMA(f)	N(m)	N(f)	DIN(m)	DIN(f)	2.92(m)	2.92(f)	2.4(m)	2.4(f)
SMA(m)	26 GHz	26 GHz	12 GHz	12 GHz			26 GHz	26 GHz		
SMA(f)	26 GHz	26 GHz	12 GHz	12 GHz			26 GHz	26 GHz		
N(m)	12 GHz	12 GHz	12 GHz	12 GHz	6 GHz	6 GHz				
N(f)	12 GHz	12 GHz	12 GHz	12 GHz	6 GHz	6 GHz				
DIN(m)			6 GHz	6 GHz	6 GHz	6 GHz				
DIN(f)			6 GHz	6 GHz	6 GHz	6 GHz				
2.92(m)	26 GHz	26 GHz					40 GHz	40 GHz	40 GHz	40 GHz
2.92(f)	26 GHz	26 GHz					40 GHz	40 GHz	40 GHz	40 GHz
2.4(m)							40 GHz	40 GHz	50 GHz	50 GHz
2.4(f)							40 GHz	40 GHz	50 GHz	50 GHz
MMCX(m)	6 GHz									

합리적인 가격의 Microwave/RF Test용 케이블 J-Link JCA Series 고대역/고성능 케이블

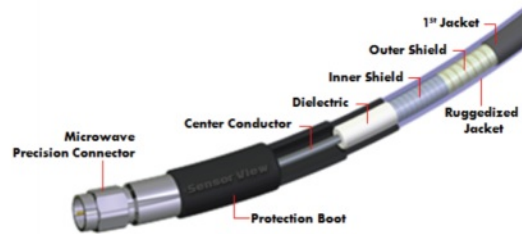
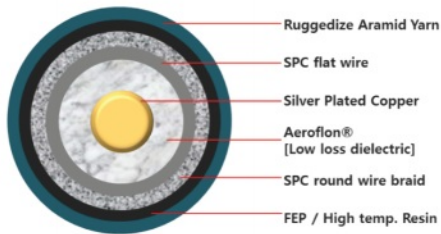
국내 케이블 전문업체와 협업하여 ODM방식으로 생산되는 가성비 최고의 고대역/고성능 케이블로서, (주)제이스의 엄격한 품질관리와 보증이 제공됩니다.

제품의 특징

- 6/18/26.5/33/40/50 GHz Bandwidth
- 케이블의 굴곡에도 Phase와 Insertion Loss 의 안정성
- 고대역에서도 낮은 VSWR
- 높은 가격대 성능비

일반적인 사용처

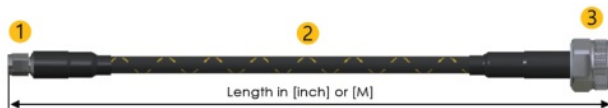
- Bench-top testing
- 무선통신 테스트 (LTE, 5G, GPS, BT 등)
- 품질테스트, 양산 테스트



▶ Ruggedized Flexible Low Loss Cable series

- Aramid Yarn Jacket / High abrasion resistance
- High temperature strength / High durability
- High Operating Frequency / Phase and I/L stability

Example of SMA to N cable assembly



JCA18S1A1N1010

- ① Connector Type
1 : male
0 : female
- ② Cable Series
- ③ Connector Type
1 : male
0 : female
- ④ Assembly Length
010 : 1M
025 : 2.5M

Coaxial connector and specification for cable

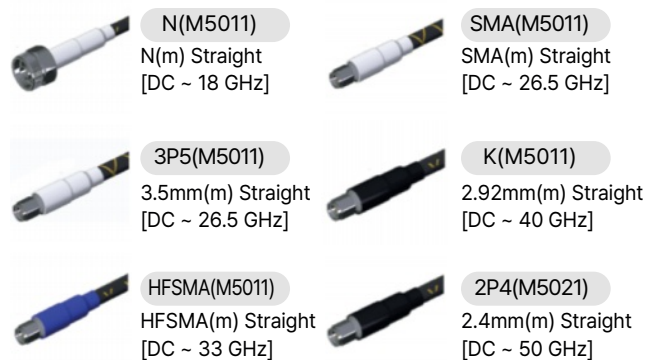
Connector Type	Frequency	Electrical Performance	
		VSWR	Insertion Loss [dB]
N	DC ~ 18 GHz	1.22 : 1	- 0.10 @ 18GHz
SMA	DC ~ 26.5 GHz	1.25 : 1	- 0.10 @ 26.5GHz
3.5 mm	DC ~ 26.5 GHz	1.25 : 1	- 0.10 @ 26.5GHz
HFSMA®	DC ~ 33 GHz	1.25 : 1	- 0.15 @ 33GHz
2.92 mm	DC ~ 40 GHz	1.25 : 1	- 0.25 @ 40GHz
2.4 mm	DC ~ 50 GHz	1.30 : 1	- 0.30 @ 50GHz

[25°C, at Sea Level]

Cable and Available Connector Series

Frequency	Available Cable	Raw Cable Insertion Loss		Available connector Series					
		[dB/m]	[dB/ft]	N	SMA	3.5mm	HFSMA	2.92mm	2.4mm
DC ~ 6 GHz	S3d, S3, A3d, A3	-0.91 max. @ 6GHz	-0.278 max. @ 6GHz	●	●				
DC ~ 18 GHz	F1, S, A1	-1.25 max. @ 18GHz	-0.381 max. @ 18GHz	●	●	●	●		●
DC ~ 26.5 GHz		-1.55 max. @ 26.5GHz	-0.473 max. @ 26.5GHz		●	●	●		●
DC ~ 33 GHz	S2d, S2, A2d, A2	-2.00 max. @ 33GHz	-0.610 max. @ 33GHz				●		
DC ~ 40 GHz	S4, A4	-2.60 max. @ 40GHz	-0.793 max. @ 40GHz					●	●
DC ~ 50 GHz	A5d	-3.90 max. @ 50GHz	-1.189 max. @ 50GHz						●

Standard Connector



합리적인 가격의 Microwave/RF Test용 케이블

J-Link JCA Series 고대역/고성능 케이블

26.5 GHz 케이블 특성

Type	26.5 GHz Low Loss		26.5 GHz Low Loss(Super Flex)		26.5 GHz Low Loss(Super Flex) Aramid Jacket		
Raw Cable Part No.	F1		S1		A1		
Mechanical							
Center Conductor Type	Stranded		Stranded		Stranded		
Center Conductor Dia.[mm]	19/0.287		19/0.287		19/0.287		
Outer Diameter[mm]	5.60 ± 0.1		6.20 ± 0.1		6.70 ± 0.1		
Minimum Bend Radius[mm]	30		30		30		
Weight[g/m]	58		75		83		
Temperature Range	-50 °C ~ 125 °C		-50 °C ~ 135 °C		-50 °C ~ 135 °C		
Electrical							
Operating Frequency	DC ~ 26.5 GHz		DC ~ 26.5 GHz		DC ~ 26.5 GHz		
Velocity of Propagation	77% nom.		77% nom.		77% nom.		
RF Leakage	-90 dB		-90 dB		-90 dB		
Insertion Loss[dB]		[dB/m]	[dB/FT]	[dB/m]	[dB/FT]	[dB/m]	[dB/FT]
	1 GHz	-0.25	-0.076	-0.25	-0.076	-0.25	-0.076
	3 GHz	-0.45	-0.137	-0.45	-0.137	-0.45	-0.137
	6 GHz	-0.65	-0.198	-0.65	-0.198	-0.65	-0.198
	10 GHz	-0.88	-0.268	-0.88	-0.268	-0.88	-0.268
	12 GHz	-0.97	-0.296	-0.97	-0.296	-0.97	-0.296
	18 GHz	-1.25	-0.381	-1.25	-0.381	-1.25	-0.381
26.5 GHz	-1.55	-0.473	-1.55	-0.473	-1.55	-0.473	
Average Power Rating[W] @ 25°C, at Sea Level							
1 GHz	696		665		665		
3 GHz	397		357		357		
6 GHz	285		272		272		
10 GHz	220		211		211		
12 GHz	201		192		192		
18 GHz	164		157		157		
26.5 GHz	136		130		130		

50 GHz 케이블 특성

Type	50 GHz Low Loss(Flex) Aramid Jacket			
Raw Cable Part No.	A5d			
Mechanical				
Center Conductor Type	Solid			
Center Conductor Dia.[mm]	0.7			
Outer Diameter[mm]	4.7 ± 0.1			
Minimum Bend Radius[mm]	20			
Weight[g/m]	58			
Temperature Range	-50 °C ~ 135 °C			
Electrical				
Operating Frequency	DC ~ 50 GHz			
Velocity of Propagation	77% nom.			
RF Leakage	-90 dB			
Insertion Loss[dB]		[dB/m]	[dB/FT]	
	1 GHz	-0.44	-0.134	
	3 GHz	-0.78	-0.237	
	6 GHz	-1.14	-0.347	
	12GHz	-1.67	-0.509	
	28 GHz	-2.73	-0.832	
	40 GHz	-3.38	-1.031	
50 GHz	-3.9	-1.189		
Average Power Rating[W] @ 25°C, at Sea Level				
1 GHz	320			
3 GHz	185			
6 GHz	131			
12 GHz	93			
28 GHz	61			
40 GHz	51			
50 GHz	45			

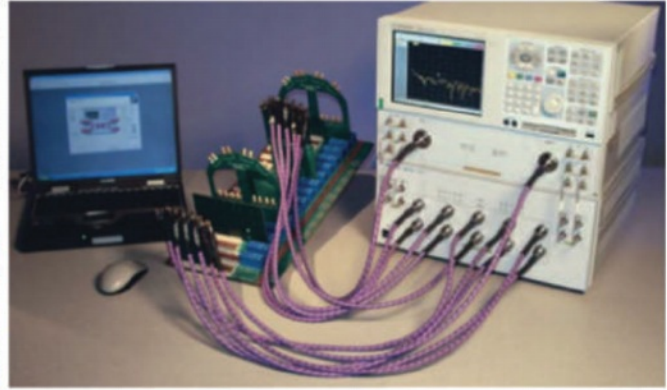
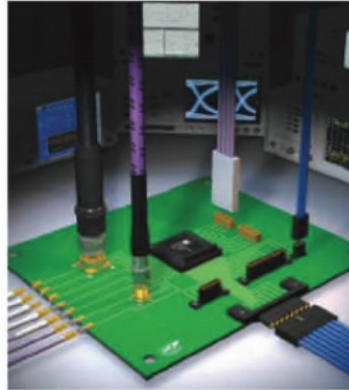
고성능 Microwave/RF Test용 케이블 GORE® PHASEFLEX® 고성능 케이블

세계적인 고성능 케이블 제조업체 GORE사 제품들로서, (주)제이스는 GORE사와의 파트너 업무협약을 통해 제품을 공급하고 기술지원하고 있습니다.

내구성 좋고 신뢰도 높은 성능의 케이블을 사용하면 측정에 소요되는 총 비용을 줄일 수 있습니다. 정확하고 반복성 높은 측정 결과를 얻을 수 있으며, 튼튼하고 가벼운 구조로 오래 사용이 가능합니다.

일반적인 사용처

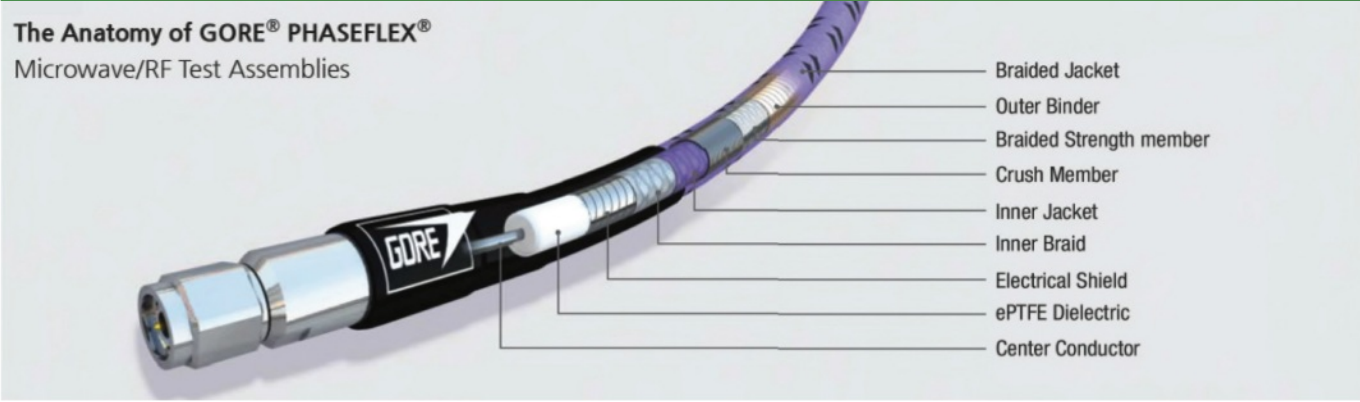
- Bench-top Testing
- Anechoic Chamber
- RF Production Test
- Near Field Scanner
- Portable Analyzer
- Wireless Module Test
- Test Rack System
- EMI/EMC Test
- VNA
- Automated Test
- Antenna Ranges



VNA와 RF테스트에 사용되는 고어 제품의 장점

- 18/40/67/110 GHz Bandwidth
- 110 GHz까지 정확하고 안정적인 측정 가능
- 케이블의 굽곡(Flexure) 에도 불구하고, Amplitude와 Phase의 안정성이 뛰어남
- 높은 내구성을 갖는 케이블 구조로 뛰어난 신뢰성을 보여줌

그림1



GORE® PHASEFLEX®는 그림 1과 같이 고유의 안정적이고 튼튼한 구조로 구성되어 있어 케이블의 휘어짐에 따른 위상과 크기의 안정성이 우수합니다. 어떤 케이블 종류는 최소의 곡률 반경이 0.5인치 정도를 자랑합니다. GORE 특유의 구조는 더 긴 사용시간을 보장합니다.

고성능 Microwave/RF Test용 케이블

GORE® PHASEFLEX® 고성능 케이블

18 GHz 까지 사용 가능한 RF 케이블 특성표

GORE Cable Type		OY	OH	OX	OS	OU	OQ	OP	OM	
ELECTRICAL PROPERTIES	Maximum Frequency(GHz)	3	18	18	18	18	18	18	18	
	Typical VSWR	1.05:1	1.19:1	1.19:1	1.19:1	1.19:1	1.22:1	1.24:1	1.28:1	
	Typical Insertion Loss(dB)	0.48	2.15	1.13	1.36	1.36	0.80	1.00	0.75	
	Impedance(Nominal) (Ohms)	75	50	50	50	50	50	50	50	
	Guaranteed Phase and Amplitude Stability	No	No	No	No	Yes	No	No	No	
	Typical Phase Stability(degree)	± 0.5	± 2.0	± 2.0	± 2.0	± 2.0	± 8.0	± 6.0	± 15.0	
	Typical Amplitude Stability(dB)	< ± 0.05								
	Dielectric Constant(Nominal)	1.4								
	Velocity of Propagation(Nominal) (%)	85								
	Shielding Effectiveness(dB through 18 GHz)	>100								
Time Delay(Nominal) ns/cm(ns/in)	0.04 (0.103)									
MECH./ENV. PROPERTIES	Center Conductor	Solid	Stranded	Solid	Stranded	Stranded	Solid	Stranded	Solid	
	Overall Diameter mm(in)	7.5(0.295)	5.3(0.210)	7.7(0.305)	7.7(0.305)	7.7(0.305)	10.2(0.400)	10.2(0.400)	10.7(0.420)	
	Nominal Weight g/m(oz/ft)	144.4(1.55)	68.9(0.74)	147.6(1.6)	147.6(1.6)	147.6(1.6)	275.6(2.96)	275.6(2.96)	295.3(3.17)	
	Minimum Bend Radius mm(in)	25.4(1.0)	12.7(0.5)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	38.1(1.5)	38.1(1.5)	38.1(1.5)	
	Typical Flex Cycles	50,000	100,000	50,000	100,000	100,000	10,000	15,000	10,000	
	Temperature Range(°C)	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 125	
	Crush Resistance kgf/cm(lbf/in)	44.6(250)	33.5(187)	44.6(250)	44.6(250)	44.6(250)	44.6(250)	44.6(250)	44.6(250)	

67 GHz 까지 사용 가능한 RF 케이블 특성표

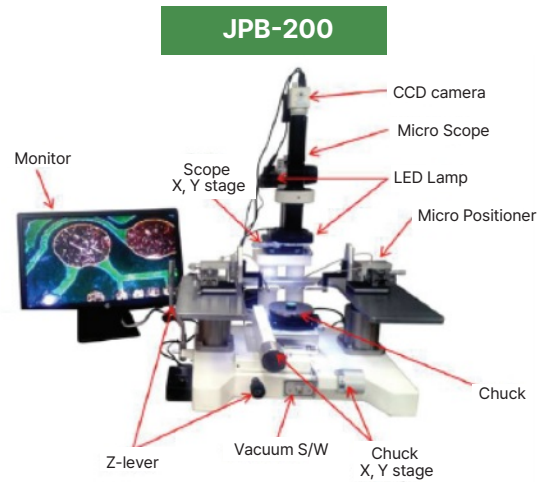
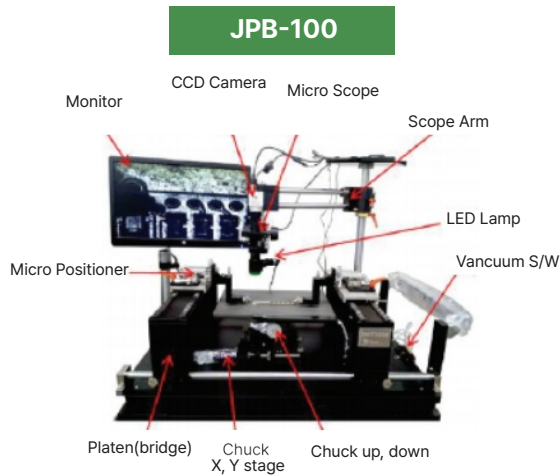
GORE Cable Type		OW	OR	OT	OK	OD	ON	OZ	OF	
ELECTRICAL PROPERTIES	Maximum Frequency(GHz)	26.5	26.5	26.5	40	40	50	50	67	
	Typical VSWR	1.17:1	1.17:1	1.17:1	1.30:1	1.30:1	1.25:1	1.26:1	1.30:1	
	Typical Insertion Loss(dB)	1.43	1.71	1.71	2.65	3.35	3.67	3.78	5.84	
	Impedance(Nominal) (Ohms)	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Guaranteed Phase and Amplitude Stability	No	No	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	
	Typical Phase Stability(degree)	± 3.0	± 3.0	± 3.0	± 5.0	± 5.0	± 6.0	± 6.0	± 8.0	
	Typical Amplitude Stability(dB)	< ± 0.05								
	Dielectric Constant(Nominal)	1.4								
	Velocity of Propagation(Nominal) (%)	85								
	Shielding Effectiveness(dB through 18 GHz)	>100								
Time Delay(Nominal) ns/cm(ns/in)	0.04(0.103)									
MECH./ENV. PROPERTIES	Center Conductor	Solid	Stranded	Stranded	Solid	Solid	Solid	Solid	Solid	
	Overall Diameter mm(in)	7.7(0.305)	7.7(0.305)	8.0(0.315)	6.1(0.240)	6.1(0.240)	5.3(0.210)	6.1(0.240)	5.8(0.230)	
	Nominal Weight g/m(oz/ft)	147.6(1.6)	147.6(1.6)	147.6(1.6)	98.4(1.05)	101.7(1.1)	68.9(2.4)	101.7(1.1)	88.6(0.95)	
	Minimum Bend Radius mm(in)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	25.4(1.0)	
	Typical Flex Cycles	50,000	100,000	100,000	50,000	20,000	12,500	20,000	20,000	
	Temperature Range(°C)	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 125	-55 to 75	-55 to 125	-55 to 75	-55 to 75	
	Crush Resistance kgf/cm(lbf/in)	44.6(250)	44.6(250)	44.6(250)	44.6(250)	44.6(250)	33.5(187)	44.6(250)	44.6(250)	

Probe Station J-Link JPB Series 프로브 스테이션

국내 Probe Station 제작 전문업체와 협업하여 ODM/OEM 생산되는 제품으로서, (주)제이스의 엄격한 품질관리와 보증이 제공됩니다.

Probe Station 이란?

- Probe Station은 반도체 칩이나 보드 안의 작은 패드에 Probe Tip 이라는 미세한 바늘을 접촉함으로써, 칩의 전기적 특성을 확인 할 수 있는 장비
- 계측기에 사용되는 기존의 Lead 선이나 Cable 대신 Probe Tip DUT 에 Contact
- Module Test 에서 측정하기 어려웠던 데이터도 DUT 에 직접 Probing 을 하여 데이터를 얻을 수 있음

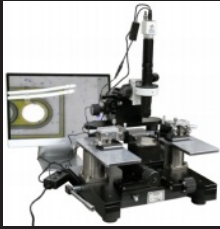


Item	Specification
CCD Camera	<ul style="list-style-type: none"> · 1/2 CCD Camera(Analog) · Option: HDMI, USB camera · 측정시료를 Monitor로 확인
Micro Scope	<ul style="list-style-type: none"> · 15~380 x, zoom control(20" monitor) · Option: Side Scope
Scope X,Y stage	<ul style="list-style-type: none"> · X,Y axis travel range :±120 mm · Z focus range: ±15 mm
LED Lamp	<ul style="list-style-type: none"> · For Scope · Spot&ring light · 시료 확인을 위해 scope에 light 인가
Micro Positioner	<ul style="list-style-type: none"> · X, Y, Z 의 미세조정으로 시료에 probing · option: EZ Probe(TDR Probe용)DC Positioner
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> · weight: 50 kg · size(mm): 800(w) x 600(d) x 750(h)
Chuck	<ul style="list-style-type: none"> · 250 mm chuck/Eng.plastic · 시료를 올려놓음(package) · Vacuum(200 mm) or Clamp
Chuck X,Y stage	<ul style="list-style-type: none"> · X,Y axis travel range: ±100 mm · X,Y 방향으로 이동하여 측정 위치를 찾음
Vacuum Switch	<ul style="list-style-type: none"> · 측정시료 고정용
Chuck up/down	<ul style="list-style-type: none"> · Platen Z: travel range 30 mm
Platen	<ul style="list-style-type: none"> · Positioner 를 장착 · Platen이 X axis로, Positioner 가 Y axis · 이동이 가능(대면적 Probing 에 용이)
Instrument&monitor	<ul style="list-style-type: none"> · Instrument: LCR, N/A, Oscilloscope... · LCD Monitor: 20"~ · Probing

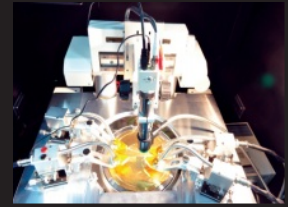
Item	Specification
CCD Camera	<ul style="list-style-type: none"> · 1/2 CCD Camera(Analog) · Option: HDMI, USB camera · 측정시료를 Monitor로 확인
Micro Scope	<ul style="list-style-type: none"> · 15~380 x, zoom control(20" monitor) · Option: Side Scope
Scope X,Y stage	<ul style="list-style-type: none"> · X,Y axis travel range :±20 mm · (한 바퀴 회전시 8mm 이동)
LED Lamp	<ul style="list-style-type: none"> · For Scope · Spot&ring light · 시료 확인을 위해 scope에 light 인가
Micro Positioner	<ul style="list-style-type: none"> · X,Y,Z의 미세조정으로 시료에 probing · DC Triaxial or coaxial Holder · Noise level : -1 pA(option: 100 fA, ~300 fA) · option: Nano positioner RF Positioner
Dimension	<ul style="list-style-type: none"> · weight: 40~45 kg · size(mm): 480(w) x 490(d) x 500(h)
Chuck	<ul style="list-style-type: none"> · 50 mm or 100 module chuck · option: chuck theta(±7°) · 시료를 올려놓음 (wafer or package)
Chuck X,Y stage	<ul style="list-style-type: none"> · X,Y axis travel range: 25 mm · X,Y 방향으로 이동하여 측정 위치를 찾음
Vacuum Switch	<ul style="list-style-type: none"> · 측정시료 고정용
Z-Lever	<ul style="list-style-type: none"> · Platen Z: 10 mm rough adjust, knob up/down · 10 mm fine adjust knob
Instrument	<ul style="list-style-type: none"> · Instrument:I-V, R Test · option: LCR, N/A, Oscilloscope, Z/A...
Monitor	<ul style="list-style-type: none"> · LCD monitor:20"~ · Probing

Probe Station

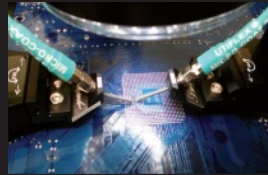
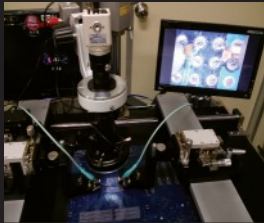
J-Link JPB Series 프로브 스테이션



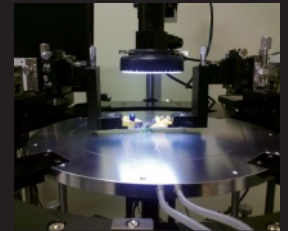
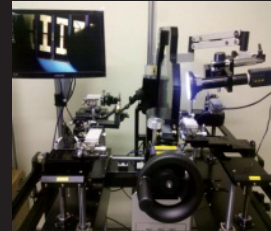
Probe Station(General type)
- Wafer, Chip/RF&DC -



High Power Test
- Wafer, Chip/DC -



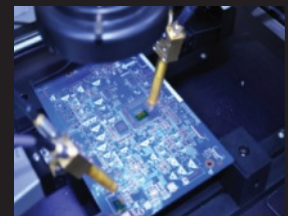
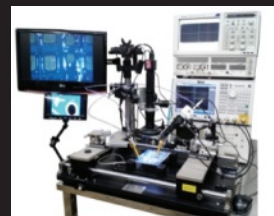
Board Test Station(Single Side)
- PCB, Board, Probe card/RF&DC -



Board Test Station(Double Side)
- PCB, Board, Probe card/RF -



Vacuum Station/Glove Box Station
- Wafer, Chip/DC -



- PCB - SI/PI Test -
Probe Tip(Hard & Variable Pitch)



RF/DC Positioner



Test Jig



Triaxial Cable&Connector



Refurbish&Repair

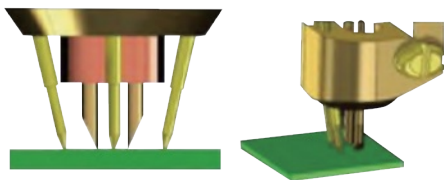
TDR/VNA 용 프로브

Giga-probe 고대역/정밀 측정 프로브

프로빙 기술 전문기업인 미국 DVT사의 고대역 정밀 측정 프로브로서, TDR/임피던스 측정에 최고의 효율을 제공합니다.
(주)제이스는 DVT사의 아시아 총판으로서 제품공급과 기술지원을 책임지고 있습니다.

고대역 RF/디지털 신호 측정에 최적화된 TDR/VNA용 프로브

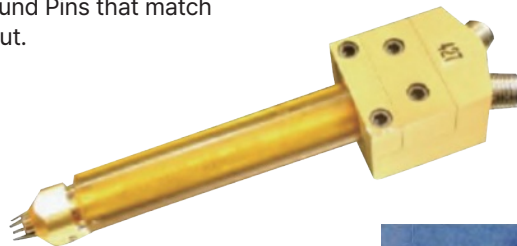
- 주파수 대역: 30 GHz, 40 GHz
- Pitch: 0.3 mm ~ 1.7 mm(Variable)
- Handling: Hand Held or Mount in Probe Positioner
- 지원하는 모드: Differential 100 Ohm 또는 Single End 50 Ohm(변환가능)
- 주요 사용처: TDR 임피던스 또는 VNA S-parameter의 측정
- 그라운드 핀 모드: GS, SG, SS, GSGSG, GSSG, SGS, GSS, SSG 등
- 커넥터 타입: 30 GHz → SMA(f), 40 GHz → 2.92 mm(f)



Configurable Ground Pins that match physical pad layout.

Instrument Compatibility

- Time Domain Reflectometry(TDR)
- Vector Network Analyzers(VNA)
- Spectrum Analyzers
- Bert Scopes

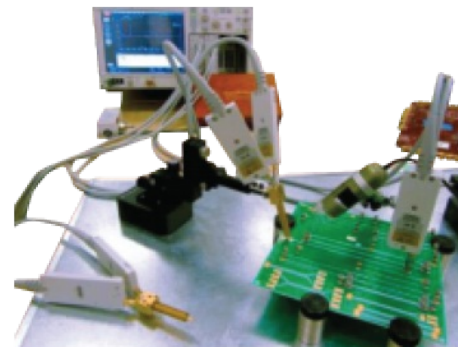
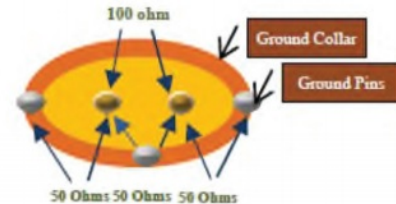


Measure 2 or 4-port S-parameters

Remove Ground Collar to Measure 100 or 50 Ohm Impedance



Impedance between pins

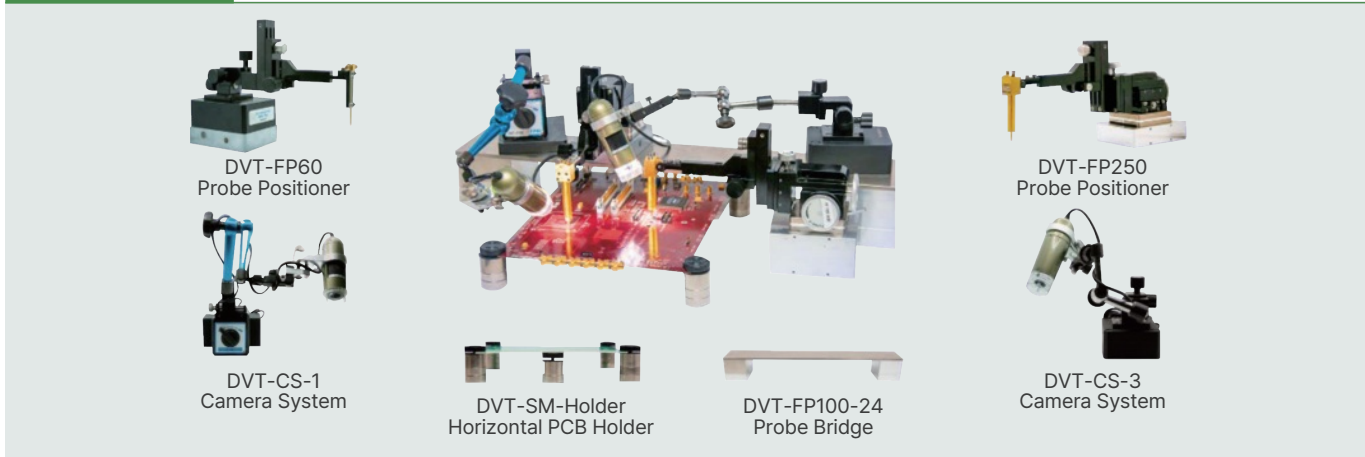


안정적이고 정확한 측정을 위해 필요한 Simple Positioner과 프로브 구성표

DESCRIPTION	MODEL	MAKER	SPECIFICATION	Q'ty
2 of 40 GHz Gigaprobe Set	DVT40-1MM	DVT Solutions	2 of 40 GHz Gigaprobe set with diamond tips and Acc kit (Cable 별도)	1
1 mm Pitch Ground Collar	DVT40-GC-1 MM-L	DVT Solutions	1 mm pitch Ground Collar with 3 spring loaded ground probes	2
Replacement Pogo Pins	DVT-PP-12 mm	DVT Solutions	Replacement Pogo Pins Qty:20 with 12 mm length	1
Cable	0K0CQ0CP0360	GORE	40 GHz, 2.92 mm male to 2.92 mm female, 36 inch	4
Probing Solution	DVT-SM Holder	DVT Solutions	Stackable Magnetic PCB Holder	4
Probing Solution	DVT-FP60	DVT Solutions	Rigid arm probe manipulator with XYZ pitch 40 TPI controls & magnetic base.	2
Camera System	DVT-CS-4	DVT Solutions	Camera System used for accurate placing of probe tips on a testpads.	2

TDR/VNA 용 프로브 Giga-probe 고대역/정밀 측정 프로브

프로브 사용 예시



측정 주파수와 환경에 맞춰서 프로브를 선택

World-Class
True Differential
Probes



DVT-FPPXX: 70 GHz



DVT-40: 40 GHz

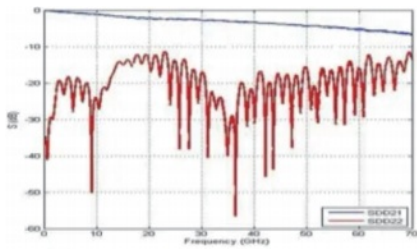


DVT-30: 20 GHz

FPP Probe Series(40 GHz, 50 GHz, 70 GHz and 110 GHz)



- 100 ohm true odd mode differential
- 2 signal pins only – no ground pins
- 모델: 40 GHz, 50 GHz, 70 GHz and 110 GHz
- Multiple probe pin pitches 1.0 mm, 0.8 mm and 0.6 mm pin pitches(고정 피치)
- Multiple 3 hole mounting configurations
- Custom mounting configurations available
- Multiple pin lengths available as options
- 개별 프로브에 대한 디임베딩 파일 제공



70 GHz 모델의 SDD21/SDD11 그래프



DVT-FP250 포지셔너와 결합

모델

DVT-FPP40 : DC~40 GHz 대역, Differential 프로브, 2.92 mm female 커넥터

DVT-FPP50 : DC~50 GHz 대역, Differential 프로브, 2.4 mm female 커넥터

DVT-FPP67 : DC~70 GHz 대역, Differential 프로브, 1.85 mm female 커넥터

DVT-FPP110 : DC~110 GHz 대역, Differential 프로브, 1 mm female 커넥터

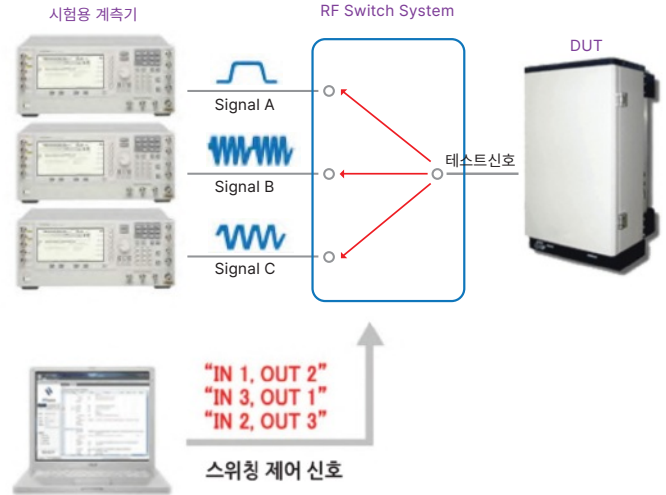
RF 스위치 시스템

J-Link JSS Series RF 스위치 시스템

국내 스위치 시스템 제작 전문업체와 협업하여 자체 제작 및 ODM/OEM 생산되는 제품들로서, (주)제이스의 엄격한 품질관리와 보증이 제공됩니다.

RF 스위치

- 고주파 신호경로를 소프트웨어를 이용하여 자동으로 신호결선을 변경하는 장비입니다.
- 다수의 측정장비와 측정시료를 한번에 자동으로 측정이 가능하도록 구성이 가능합니다.
- 사용자의 요구사항에 맞춰서 구현이 가능합니다.
- 지원가능 스위치 포트 : 2~52포트
- 주파수 : DC~26 GHz
- 입/출력포트 : SMA, N 타입 등



Modular RF Switch System

- 사용자의 필요에 따라서 최대 52채널의 자유로운 채널 구성이 가능한 Module형 Switch System



JSS-MF-4-24



JSS-MD-1-2



JSS-MD-1-6



JSS-MD-2-2

Frequency Range	DC to 18 GHz
No. of Channel	Max. 52 Ch(모듈형태로 구성)
RF Switch Configuration(Default)	SPDT 12, SD6T 4, DPDT 2
Slot Qty.	Max. 22 Slot
RF Connector	Type-N(f)

Electro Mechanical RF Switch System

- High Power 의 장점을 갖는 Electro Mechanical 스위치 시스템



JSS-EM

Frequency Range	DC to 40 GHz
No. of Channel	4~8 Ch
VSWR	1.7:1 Maximum
Max. RF Input Power	+30 dBm(1Watt)
RF Connector	2.92 mm female

Solid State RF Switch System

- 빠른 속도와 높은 빈도의 스위칭에 적합한 스위치 시스템



JSS-SS

Frequency Range	20 MHz – 40 GHz
No. of Channel	8 Ch
VSWR	1.5:1 Maximum
Max. RF Input Power	+20 dBm(20 MHz – 100 MHz) +30 dBm(100 MHz – 4300 MHz)
RF Connector	SMA female
Switching Speed	15 us(after command is received and processed)

근접장 안테나 프로브

EMI안테나/프로브(DC ~ 3 GHz, JEMI-4A)

(주)제이스는 전세계 파트너사를 통해서 우수한 성능의 가성비제품을 공급하고 있습니다.

EMI측정을 위해서 편리한 근접장안테나와 오실로스코프 또는 스펙트럼 분석기를 활용해서 측정하시길 바랍니다.

키사이트의 신형 HD3 오실로스코프는 14비트, 3.2 GSample/sec 성능의 ADC를 장착하고 있어서 기존의 오실로스코프에서 분석이 불가능했던 -100 dBm 크기의 신호도 분석이 가능합니다.

HD3 오실로스코프와 EMI안테나의 조합으로 정확하고 편리하게 EMI 성분을 측정/분석이 가능합니다.

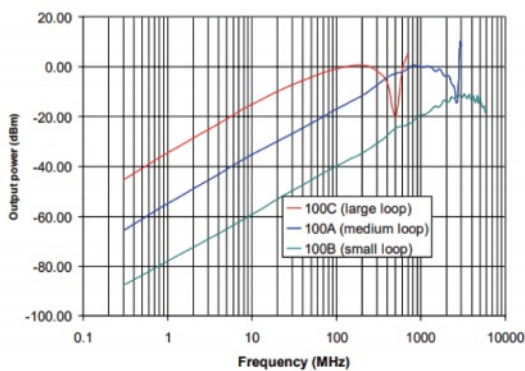


4가지 종류의 근접장 안테나(Length 16 cm)



약한 신호 증폭용 앰프(32 dB Gain)

Model Number	Tip Diameter(in)	3 dB Freq.(MHz)	Note
100C(large loop)	1.0	300	자기장 프로브 (Magnetic Flux)
100A(medium loop)	0.5	1000	
100B(small loop)	0.25	3100	
100D(stub)	0.08	3000	전기장 프로브(Electric field)



프로브별 주파수 응답곡선



HD3 오실로스코프
(-100 dBm 이하의 노이즈 플로어)

고속 디지털 신호 측정용 픽스처

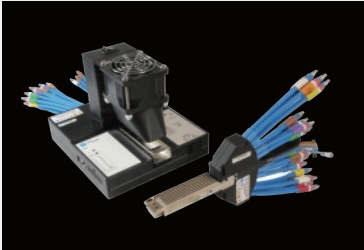
Wilder 디지털 신호 측정용 픽스처

고속 디지털 신호 측정용 테스트 픽스처 전문업체인 미국 Wilder Technologies사의 제품들로서, 여러 규격의 디지털 신호 측정 및 인증이 가능한 픽스처를 제공합니다. (주)제이스는 Wilder Technologies사의 공식 국내 대리점으로서, 제품 공급과 기술 지원을 제공하고 있습니다.

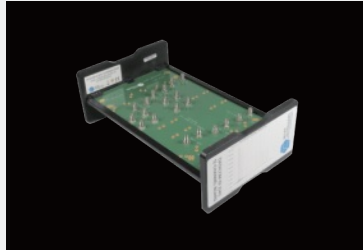
고속 디지털 신호를 정확하게 측정하려면, SI(Signal Integrity) 를 위해 측정용 Fixture 의 정확한 선택이 중요합니다. Wilder의 견고한 픽스처는 전체 전송선로 구간에서 매우 뛰어난 전기적 성능과 튼튼한 연결성을 통해, 정확하고 반복가능한 측정환경을 제공합니다. Wilder의 픽스처는 아래의 디지털 통신규격을 지원하는 픽스처를 제공합니다.

DataComm

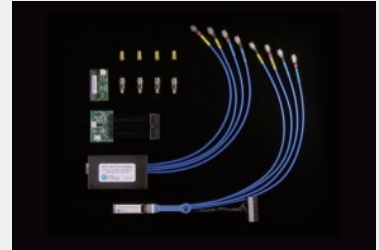
OSFP 및 QSFP-DD 폼 팩터의 호스트 컴플라이언스 보드와 모듈 컴플라이언스 보드, 채널 에뮬레이션 및 스트레스 수신기 입력 스트레스 교정을 위한 다양한 차동 손실 트레이스를 제공하는 ISI 채널 픽스처가 포함됩니다. 픽스처 세트는 1.6 T 애플리케이션에 사용되는 최대 58 GBaud PAM4 신호의 레인 속도를 지원하기 위해 60 GHz 이상에서 동급 최고의 성능을 제공합니다.



- OSFP 224 G
- QSFP-DD 224 G
- DCOM ISI 224 G
- DCOM ISI 112 G



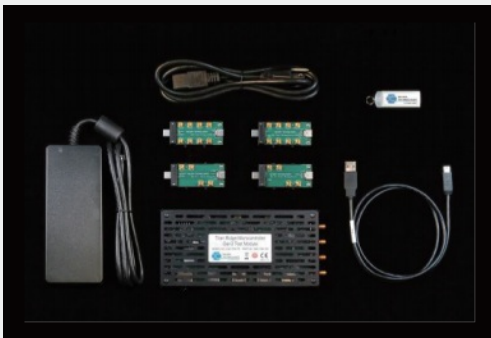
- QSFP-DD 112 G
- OSFP 112 G
- SFP-DD
- SFP112
- QSFP112



- QSFP28/QSFP56
- SFP28/SFP56
- QSFP+
- SFP+

Thunderbolt™

Test adapters와 Test fixture는 소스 및 싱크 적합성 테스트를 용이하게 해줍니다.



- Thunderbolt Microcontroller Gen5/Gen4/Gen3
- Thunderbolt Gen2 Test fixtures



고속 디지털 신호 측정용 픽스처

Wilder 디지털 신호 측정용 픽스처

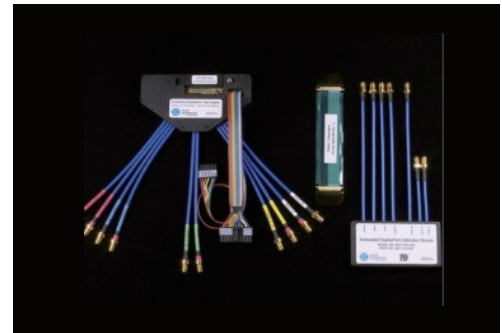
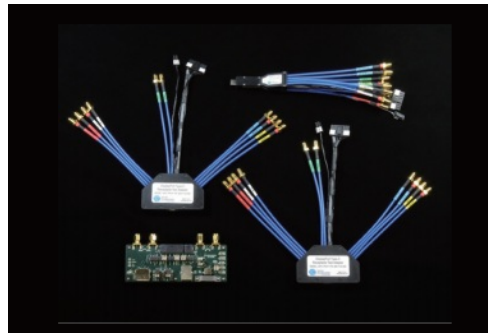
- **USB4 V2 COMPLIANCE**
- **USB4 Microcontroller**
- **USB3.2**
- **USB Type-C**



DisplayPort™

Enhanced DisplayPort™ 및 miniDisplayPort™ 테스트 어댑터는 DP2.1 사양에 따른 호스트 및 장치 테스트를 지원합니다.

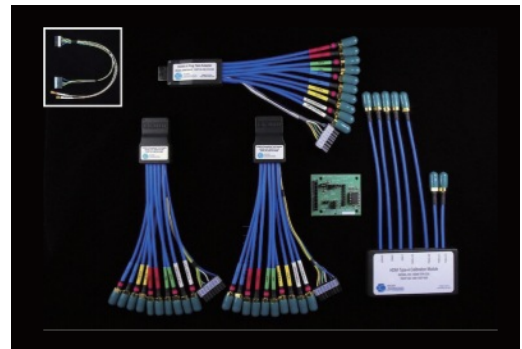
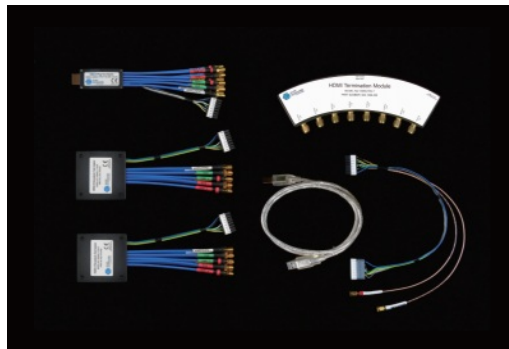
- Enhanced-mDP
- Enhanced-DP
- DPAC-CAM
- DisplayPort™ USB Type-C®
- DisplayPort™
- Dual Mode DP
- Mini DP
- Dual Mode Mini DP
- EDP 40
- EDP 30
- MYDP



HDMI

Test adapters와 Test fixture는 소스 및 싱크 적합성 테스트를 용이하게 해줍니다.

- Type-A V2.2
- Type-A V2.1
- Type-A V2.0
- Type-A HEAC
- Type-D V2.0
- Type-A V1.3
- FRL/EDID V2.1



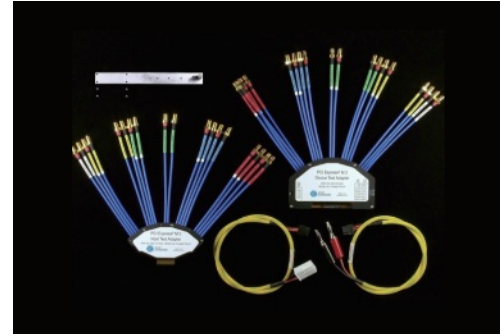
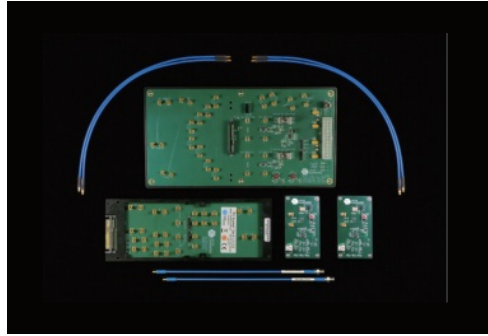
고속 디지털 신호 측정용 픽스처

Wilder 디지털 신호 측정용 픽스처

PCIe

PCIe G5 M.2 소켓3 CLB 및 CBB는 MMPX 커넥터를 사용하여 PCIe CEM 세트와의 호환성을 유지하면서 사전 규정 준수 테스트를 지원합니다.

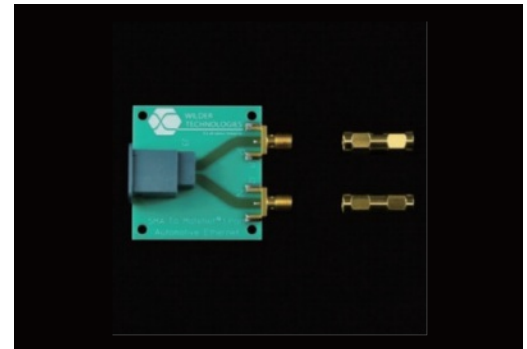
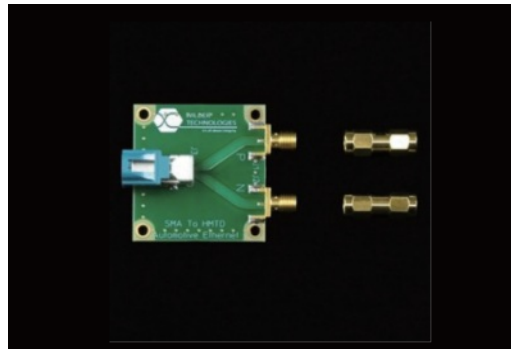
- U.2 GEN5
- M.2 GEN5 SOCKET3
- M.2 GEN4 SOCKET2
- M.2 GEN4 SOCKET3
- SFF 8639 GEN4(U.2)



Automotive

MateNet(TE), H-MTD(Rosenberger), Mini50(Molex) 등 다양한 커넥터를 통해 100/1000 규격을 준수합니다. 또한, 엔지니어가 원하는 커넥터를 연결할 수 있도록 일반 솔더링 보드를 제공합니다.

- Automotive Ethernet Common Mode
- Automotive Ethernet Distortion and Common Mode kit
- Automotive Ethernet Single Port HMTD
- Automotive Ethernet Single Port TE
- Automotive Ethernet Distortion
- Automotive Ethernet Open Solder
- Automotive Ethernet Single Port Molex



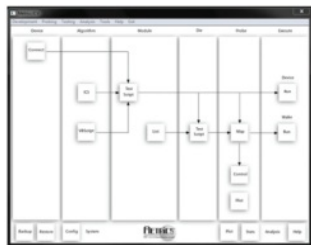
Metrics 반도체 특성(IV, CV) 측정 소프트웨어

반도체 특성 측정 전문업체인 미국 Metrics사의 자동화 소프트웨어로서, 계측기와 연동한 IV, CV 특성 측정에 최적화되어 있습니다. (주)제이스는 Metrics사의 공식국내 대리점으로서, 제품 공급과 기술 지원을 책임지고 있습니다.

Product Selection Matrix

	Metrics Win4145	Metrics Win4156	Metrics WinB2900	Metrics ICS	Metrics ICV
Graphical Test Setup	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
VBScript Support	No	No	No	No	No
Matrix Support	No	No	No	No	No
Prober Support	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Instrument Support	HP4145 A, B	HP4155 A, B, C HP4156 A, B, C	Keysight B2900A Series B2901A, B2902A B2911A, B2912A	Keysight IV, CV Keithley IV, CV Tektronix 370/371 A, B	Keysight IV, CV Keithley IV, CV Tektronix 370/371 A, B

*Metrics 4.4 제품은 Windows10/11 OS를 지원합니다.



Simple Workflow Based Interface

Metrics ICV improves productivity and reduces the time to implement complex tests and click editors for setting up each aspect of the test. This single unified environment allows for specifying everything from switch matrix device connections, module level actions, die navigation including sub-die definitions and wafer plan setup and execution. This workflow interface is separated into logical steps defining the sequence necessary to set up a device level or full wafer level test methodology. Perform system configuration and maintenance function like backup and restore as well as launch other provided tools from the same common user interface.

Keysight (Agilent)		Keithley, Tektronix	
Model	Description	Model	Description
4140B	pA Meter/DC Voltage Source	236	Source Measure Unit
4142B	Modular DC Source/Monitor	237	High Voltage Source Measure Unit
4145A/B	Semiconductor parameter Analyzer	238	High Voltage Source Measure Unit
4155A/B/C	Semiconductor parameter Analyzer	2400 Series	Digital Source Meter
4156A/B/C	Semiconductor parameter Analyzer	6430	Sub-fA Source Meter
E5270B	8-slot Precision Measurement Mainframe	2600A Series	Digital Source Meter
5272A	2-slot High Speed Source Monitor Unit	4200-SCS	Semiconductor Test System
5273A	2-slot High Speed Source Monitor Unit	82	C-V Characterization System
E5260A	8-slot High Speed Measurement Mainframe	90	I-V Semiconductor Test System
5262A	2-slot High Speed Source Monitor Unit	590	C-V Analyzer
5263A	2-slot High Speed Source Monitor Unit	595	C-V Quasi-static CV meter
B1500A	Semiconductor Device Analyzer	370A/B	Curve Tracer
B1505A	Power Device Analyzer/Curve Tracer	371A/B	High Power Curve Tracer
B2900A/B/C Series	Precision Source/Measure Unit		
4275A	10 Hz-10 MHz Multi-frequency LCR Meter		
4280A	1 MHz C-Meter/CV Plotter		
4284A	20 Hz - 1MHz Precision LCR Meter		
4285A	75 Hz - 30 MHz Precision LCR Meter		
4192A	5 Hz - 13 MHz Low Frequency Impedance Analyzer		
4194A	40 Hz - 110 MHz Impedance Analyzer		
E4980A/B	20 Hz - 2 MHz Precision LCR Meter		

System

J-Link Dielectric: 유전율/유전손실 측정	P.20
E5080B-TDR: 네트워크/임피던스 분석기	P.22
Streamline Series: VNA with TDR	P.23
CT100B Series: 케이블/TDR 분석기	P.24
Huntron Tracker: PCB 검사/수리 분석기	P.25
Huntron Access Probe: 자동 프로빙 시스템	P.26
측정 지원 및 기술 교육	P.27

통합 유전율 측정 시스템

J-Link Dielectric 유전율/유전손실 측정

다양한 특성을 가진 물질들의 유전율을 쉽고 간편하게 자동측정 해 주는 시스템으로서, (주)제이스가 개발 및 공급하고 있습니다.

측정 주파수에 따라서 아래 조합으로 구성

전자계측기

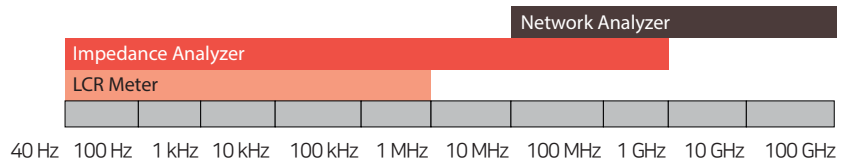
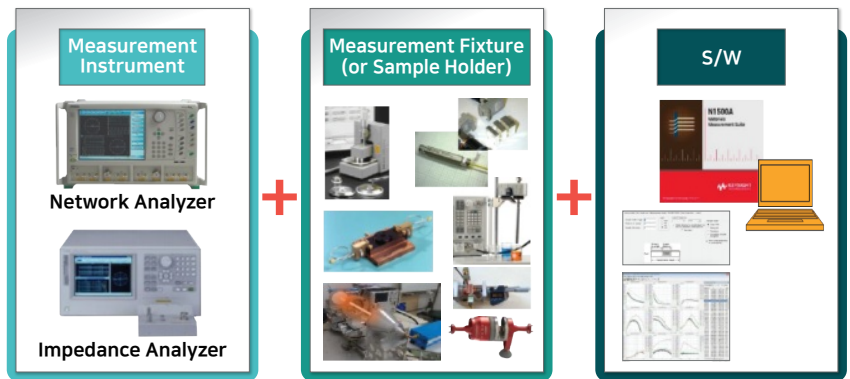
LCR 미터/임피던스 분석기/네트워크 분석기

픽스처

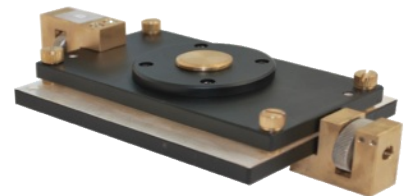
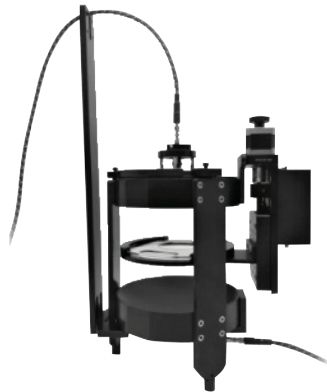
SPDR/SCR/FPOR/Parallel

프로그램

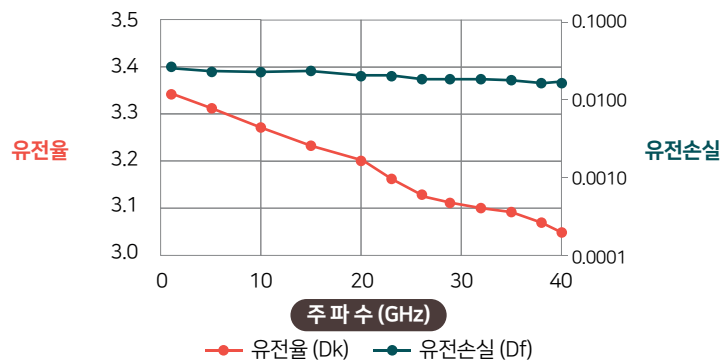
자동/수동



다양한 유전율 측정 픽스처



(측정예시) 주파수에 따른 유전율과 유전손실의 변화



유전율 측정 QR

통합 유전율 측정 시스템

J-Link Dielectric 유전율/유전손실 측정

Hz/kHz 대역(< MHz)

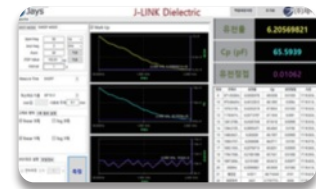
샘플 사이즈(mm) 직경 > 40 mm, 두께 < 1 mm



E4980B LCR 미터



16451B 픽스처



J-Link DE 프로그램

MHz 대역(< GHz)

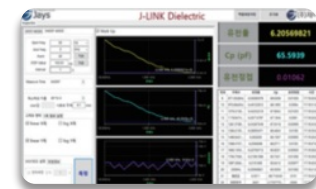
샘플 사이즈(mm) 직경 > 15 mm, 두께 < 1 mm



E4990A/E4991B
임피던스 분석기



16453A 픽스처



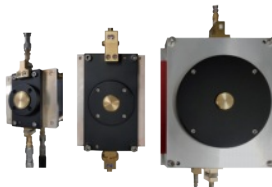
J-Link DE 프로그램

GHz 대역(< 20 GHz)

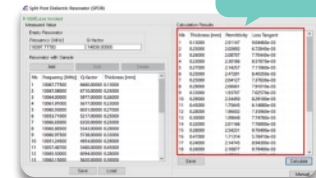
각 시료의 유전율과 유전손실이 계산됩니다.



E5063A
네트워크 분석기



SPDR 픽스처



유전율 프로그램

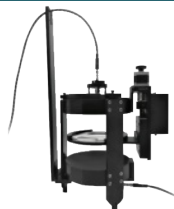
측정 주파수	추천 시료 사이즈(mm)	추천 시료 두께(mm)
1.1 GHz	130×180	< 5.0 이하
5 GHz	40×90	< 1.5 이하
10 GHz	30×90	< 0.8 이하
15 GHz	30×40	< 0.5 이하

GHz 대역 (> 20 GHz)

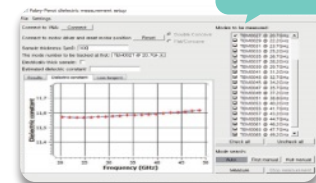
각 시료의 유전율과 유전손실이 계산됩니다.



N522xB
네트워크 분석기



FPOR 픽스처



유전율 프로그램

측정 주파수	추천 시료 사이즈(mm)	추천 시료 두께(mm)
20~110 GHz	90×90 mm	< 500 um (시료의 유전율에 따라서 다릅니다.)

경제적이고 편리한 TDR 측정

E5080B-TDR 네트워크/임피던스 분석기

Keysight사가 공급하는 고대역 네트워크/임피던스 분석기로서, 고대역/고성능의 TDR 측정 기능이 포함되어 있습니다. (주)제이스는 Keysight사의 공식 파트너로서, 제품 공급과 기술 지원을 제공하고 있습니다.



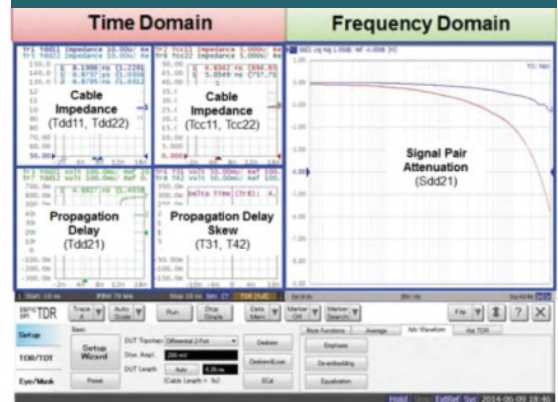
One Box Solution: Signal Integrity 디자인과 측정을 위한 최적의 기능

- 주파수 구성: 4.5/6.5/9/14/20/26.5/32/44/53 GHz
- 포트 구성: 2, 4 포트
- 시간도메인(TDR) 과 주파수 도메인(S-parameter)을 실시간 동시 측정
- 편리하고 직관적인 GUI
- Eye-Diagram 테스트
- AFR(Automatic Fixture Removal) 과 De-embedding 기능을 통한 정확한 측정 지원
- 빠르고 정확한 측정용 E-Cal 지원
- ESD에 튼튼한 구조

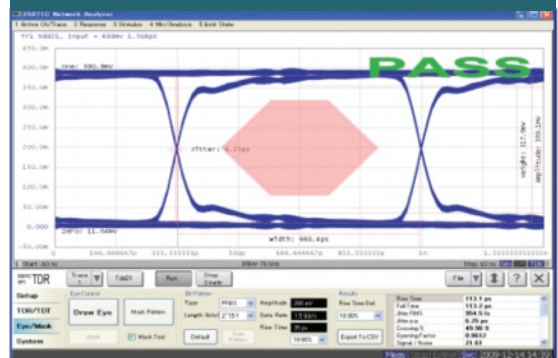
고속 디지털 전송신호 측정을 위한 MOI 및 셋업 파일 제공

표준 규격	MOI 및 셋업파일테스트 문서		
USB	USB 2.0	제공	제공
	USB 3.0	제공	제공
	USB 3.1	제공	제공
	USB C 타입	제공	제공
HDMI	HDMI 1.4b	제공	제공
	HDMI 2.0	-	제공
SATA	v3.0	제공	제공
DisplayPort	v1.2b	제공	제공
	v1.3	제공	제공
	Alt 모드	출시 예정	출시 예정
MIPI™	D-PHY v3.0	-	제공
	M-PHY v1.1	-	제공
이더넷	100 BASE-TX	제공	제공
	10G BASE-T	제공	제공
	10G BASE-KR	제공	제공
	40G BASE-KR4	제공	제공
MHL	v2.0	제공	제공
PCIe®	v3.0	제공	제공
Thunderbolt	v0.9	-	제공
BroadR-Reach	v3.2	제공	제공

주파수 영역과 시간 영역의 동시 측정



Eye-Diagram 시뮬레이션



경제적인 네트워크 분석기

Streamline Series VNA with TDR

휴대가 간편한 스트림라인 시리즈의 네트워크 분석기는 외부의 PC와 함께 사용되어, 기존의 VNA와 동일한 측정환경을 제공합니다.



Streamline Series VNA with TDR

- P937xB : 2-port UP to 44 GHz
- P938xB : 4-port UP to 20 GHz
- P500xB : 2-port UP to 53 GHz
- P502xB : 4-port UP to 53 GHz
6-port UP to 20 GHz



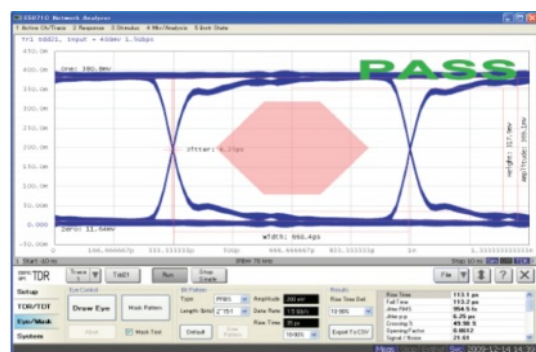
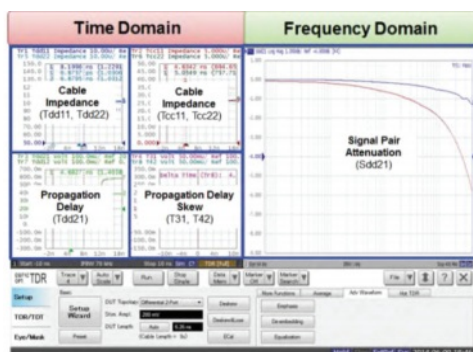
Features & Benefits

- E5080B와 동일한 사용자 인터페이스와 TDR 측정성능을 제공합니다.(TDR, S-parameter, Eye Diagram)
- 수동소자(PCB, 케이블등)의 측정에 최적화된 가성비 최고의 SI(신호무결성) 검사장비입니다.
- 키사이트의 최신 E-Cal과 호환되어 편리하고 정확한 Calibration이 가능합니다.

Dimensions / Weight	2-port	4 or 6-port
Width	176 mm (6.93 in)	176 mm (6.93 in)
Height	48 mm (1.89 in)	68 mm (2.68 in)
Depth	333 mm (13.11 in)	333 mm (13.11 in)
Weight	1.88 kg (4.14 lbs)	2.82 kg (6.22 lbs, 4-port) 2.98 kg (6.57 lbs, 6-port)

Test Port

Connector Type	3.5 mm female (P9370B to P9375B, P9382B, P9384B, P5000B to P5005B, P5020B to P5025B) 2.4 mm female (P9377B, P5006B, P5007B, P5026B, P5027B) 1.85 mm female (P5008B, P5028B)
----------------	---

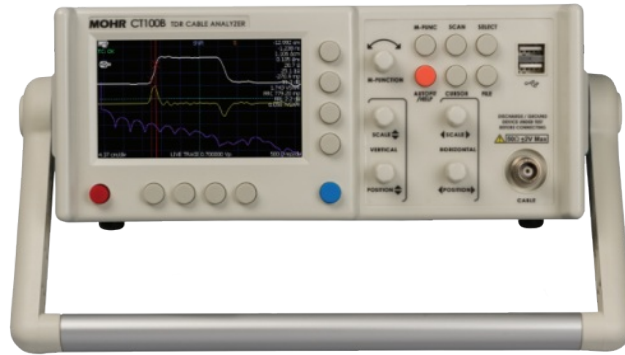


S-Parameter, TDR, Eye-diagram

비파괴 TDR 케이블 검사 CT100B 케이블/TDR 분석기

TDR분석 전문업체인 미국 MOHR사의 제품으로서 항공기/선박/발전소 등 정밀하고 복잡한 케이블들의 특성을 분석하고 검사하는 최고 성능의 측정기입니다.

국내에서는 국산헬기 "수리온"의 공식 정비 장비로 지정되어 있으며 한수원이 운영하는 원자력발전소의 운용장비로도 활용되고 있습니다. (주)제이스는 MOHR사의 국내 총판으로서 제품 공급과 기술지원을 제공하고 있습니다.



Features&Benefits

- 업계 최고의 케이블 고장 지점 탐지 능력: 상승시간 최소 60 ps의 스텝 펄스와 16 bit AD 분해기능으로 케이블의 고장 현상을 정밀하게 포착
- 업계 최고의 0.072 mm 커서 분해능과 9 mm 임피던스 변화 분해능으로 PCB, 케이블, 커넥터의 고장점을 정확히 포착
- 케이블 전체 또는 부분을 스캔하여 수백만 포인트로 저장된 데이터는 장비와 전용 소프트웨어에서 차후 분석, 비교가 가능하여 케이블과 커넥터 고품질 유지보수가 가능
- 배터리로 동작 가능하며, 견고하고 가벼운 휴대형 장비로 밝은 컬러 스크린은 야외에서도 가시성이 우수

Applications

- 모든 종류의 동축케이블과 Twisted-pair 케이블 테스트
- 케이블의 오픈, 쇼트, 꼬임, 쉴드 손상, 햇빛과 자외선에 의한 손상, 수분 유입, 커넥터 품질 저하 등 시스템의 성능을 저하시키는 모든 현상 탐지
- CATV, Power, Telephony 케이블
- 선박, 항공기 등의 케이블 유지보수
- 무선 통신 설비의 케이블 유지보수
- PCB 특성 분석
- TDR 센서 어플리케이션 (토양 수분측정, 지구과학 분야 등)
- 원격 감시 분야

Specification	MOHR CT100B
Risetime, ps(20-80 %)	100(CT100B) 60(CT100HF)
Pulse amplitude(into 50 Ω load)	300 mV
Sequential sampling rate	2 - 250 kHz
Sampling resolution	16 bits
TDR frame rate	500 fps
Horizontal scale	0.003 - 200 ft/div(0.001 - 50 m/div)
Horizontal range	0 - 30,000 ft(0 - 9 km) [†]
Horizontal resolution	0.003 in(0.075 mm)
Vertical scale	0.5 - 500 mp/div
Battery life	> 6h [‡]
Battery recharge	< 3h [‡]
I/O options	USB host/client 10/100 Ethernet
Data storage	Thousands of traces
Network integration	10/100 Mb Ethernet
Display	4.3" 480 x 272 backlit color TFT-LCD
TDR trace	Unlimited
TDR digital filtering	smooth, subtract, derivatives, FFT, S-parameters, many others
Unit Weight	4.7 lb(2.2 kg)

PCB의 문제 해결을 위한 Power-off 분석 및 진단 도구 Huntron Tracker PCB 검사/수리 분석기

PCB단위의 검사 및 수리 전문업체인 미국 Huntron사 제품으로서 Board단위 분석 및 디버깅, 수리에 최적입니다.
(주)제이스는 Huntron사의 공식 국내 대리점으로서 제품 공급과 기술 지원을 제공하고 있습니다.



Tracker Specification	Tracker 3200S	Tracker 2800S	Tracker 2800
특징	<ul style="list-style-type: none"> - 업계 최고, 업계 표준, Power-Off PCB 테스트 - 독립형 또는 Huntron Workstation 과 함께 사용 - Huntron Access Probers에 연결하여 사용 - 최대 128 핀 스캔 	<ul style="list-style-type: none"> - Huntron 워크 스테이션 지원(옵션) - 폴스크린의 시그니처 화면 확대/축소 - PCB 커넥터 테스트를위한 최대 40 핀 스캔 	<ul style="list-style-type: none"> - Huntron 워크 스테이션 지원(옵션) - 폴스크린의 시그니처 화면 확대/축소
Number of Voltages	24 voltages	6 voltages	6 voltages
Number of Resistances	16 resistances	9 resistances	9 resistances
Number of Frequencies	40 frequencies	6 frequencies	6 frequencies
Number of Scanner Pins	64 pins per Channel (combine channels for 128 pins) - selectable Common pin	40 pins per channel - Banana jack Common only	None
Huntron Workstation Software Control	Yes	Yes - Optional	Yes - Optional
Test Automation available?	Yes - Software controlled test using Access Probers, cable-based connections (i.e. PCB interface cables) or manual probes	Yes - Software controlled test using manual probes or cable-based connections (i.e. PCB interface cables)	Yes - Software controlled test using manual probes
Voltage Source for biasing gated devices (SCRs, TRIACs, relays)	Yes - Pulse Generator with DC and square wave output; Software control	Yes - DC output; No software control	Yes - DC output; No software control

PCB의 문제 해결을 위한 Power-off 분석 및 진단 도구 Huntron Access Probe 자동 프로빙 시스템

미국 Huntron사에서 PCB단위 검사와 이를 자동으로 수행해 주는 Auto Probing 기술을 제공해 주는 제품으로서, 반복작업 시 발생할 수 있는 Human Error와 시간을 줄여 효율성을 높여 줍니다. (주)제이스는 Huntron사의 공식 국내 대리점으로서 제품 공급과 기술 지원을 제공하고 있습니다.



Access Prober Specification	Access Prober	Access2 및 Access RF Prober	Access DH2 Prober
특징	<ul style="list-style-type: none"> - 단일 헤드 플라잉 프로브 스테이션 - 정확한 PCA 프로빙을 위한 탁월한 정확성 - 수년간의 내구성이 뛰어난 디자인 - Huntron Tracker® 내부에서 구성 가능 	<ul style="list-style-type: none"> - 대형 포맷, 단일 헤드 플라잉 프로브 스테이션 - 현저한 정확성으로 더 큰 PCA를 정확하게 프로브 수년간 지속된 서비스 	<ul style="list-style-type: none"> - 듀얼 헤드 플라잉 프로버 스테이션 - PCA의 정확한 점대 점 프로빙 - 자동화 요구에 맞는 견고한 구조 - Huntron Tracker® 내부에서 구성 가능
Number of Test Heads	1	1	2
Maximum Board Under Test Size	19.4" x 14" (49.3 cm x 35.6 cm)	22" x 23" (56 cm x 58 cm)	27" x 23" (68.6 cm x 58 cm)
Maximum Probing Area	15.3" x 12.9" (38.9 cm x 33.8 cm)	18.2" x 22.4" (46.2 cm x 56.9 cm)	19" x 12" (48.3 cm x 30.5 cm)
Maximum Board Component Height	2.375" (6 cm)	4" (10 cm)	4.8" (12.2 cm)
Dimensions	26.5" W x 13" H x 24.5" D (67.31 cm W x 33.02 cm H x 62.3cm D)	36" W x 15.7" H x 29" D (91.44 cm W x 39.88 cm H x 73.66 cm D)	47" W x 61.5" H x 35.75" D (119.4 cm W x 156.2 cm H x 90.8 cm D)
Accuracy and Resolution	0.0007874" (±20 microns) at 0.0003937" (10 microns) minimum	0.0007874" (±20 microns) at 0.0003937" (10 microns) minimum	0.0003937" (±10 microns) for Top Slot (6" above plate) at 0.00002" (0.4 microns)

고객 지원 측정 지원 및 기술 교육



01 고객 정기 교육 및 세미나

오실로스코프 실습 중심의 교육

- 오실로스코프를 처음 접하는 신입사원과 공학도를 대상으로, 기초 이해부터 실무 활용까지 자연스럽게 이어질 수 있도록 구성된 입문형 과정입니다. 키사이트 최신형 오실로스코프인 HD3 모델을 수강생 2인당 1대의 실습 장비로 사용해서 오실로스코프 동작에 대한 이해와 다양한 신호에 대한 분석을 목표로 합니다.

반도체 및 산업의 이해 교육

- 반도체 산업을 처음 접하는 신입 엔지니어·연구원·학생을 대상으로, 산업 전반의 흐름부터 실제 응용 분야, 그리고 계측기를 활용한 측정 실습까지 폭넓게 다루는 종합 과정입니다. 키사이트 고성능 반도체 파라미터 분석장비인 B1500A를 이용한 측정 시연을 통해 측정 방식에 대한 완벽한 이해를 목표로 합니다.

기본 범용 벤치 장비 실습 중심의 교육

- 전자회로를 처음 접하는 신입 엔지니어와 공학도를 대상으로, 전자 계측 장비의 기본 이해부터 실무 활용 능력까지 체계적으로 습득할 수 있도록 설계된 실습 중심 과정입니다. 키사이트 스마트 벤치 에센셜 패키지 장비(파워서플라이+함수발생기+디지털멀티미터)를 수강생 2인당 1세트의 실습장비로 활용하여 다양한 실습과 이론교육을 통해 실제 연구·개발·테스트 환경에서 바로 활용 가능한 역량을 확보하는 것을 목표로 합니다.



02 기술 지원 및 측정 대행 업무

Pre-Compliance Test(Test Lab)

- 고속 시리얼 어플리케이션을 측정 할 수 있는 고성능 측정장비 및 테스트 솔루션 제공
- Pre-Compliance Test에 대한 지식이 없는 고객이라도 측정을 완료 할 수 있도록 지원 및 세팅, 테스트 진행

구분	지터	임피던스	S-파라미터	Application
측정 및 분석 항목	Jitter Eye-Diagram Noise	Impedance Loss Cross Talk	반사 손실 삽입 손실	USB Ethernet PCIe DDR MIPI HDMI



본사 1600-9545 / 031-731-9545
경기도 성남시 중원구 연꽃로20번길14 제이타운

솔루션 사업부 & 부설 연구소 1600-9702
경기도 성남시 중원구 사기막골로 99 센트럴비즈타워2차 517호

대전지사 042-485-9545
대전광역시 대덕구 대화로 120 가온비즈타워 507호

(본사) www.jays.co.kr / (R&D) www.jlink.co.kr

